

Куланчиков Юрий Олегович

**Исследование влияния облучения электронным пучком на свойства
полупроводниковых структур**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Специальность **1.3.11 – «Физика полупроводников»**

Работа выполнена на кафедре полупроводниковой электроники и физики полупроводников и в лаборатории ультраширокозонных полупроводников НИТУ МИСИС.

Научный руководитель: профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС, д.ф.-м.н. Якимов Евгений Борисович

Экспертная комиссия:

1. Ховайло Владимир Васильевич - д.ф.-м.н., профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС - председатель комиссии;
2. Родин Алексей Олегович - д.ф.-м.н., профессор кафедры физической химии НИТУ МИСИС;
3. Пархоменко Юрий Николаевич - д.ф.-м.н., профессор кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ МИСИС;
4. Таперо Константин Иванович - д.т.н., заместитель генерального директора по науке и инновациям АО «Научно-исследовательский институт приборов», ГК «Росатом»;
5. Боргардт Николай Иванович – д.ф.-м.н., директор Института физики и прикладной математики ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники».

Ведущее предприятие:

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипяна Российской академии наук, г. Черноголовка

Защита диссертации состоится «04» декабря 2024 года по адресу 119049, г. Москва,

Ленинский проспект, д. 6, стр. 2.